

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）



代理人

特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ

様

あて名

〒530-6026  
日本国大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30号  
OAPタワー26階

PCT  
国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
〔PCT規則43の2.1〕

発送日  
(日.月.年)

14.6.2005

出願人又は代理人

の書類記号 H2350-02

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号  
PCT/JP2005/008533

国際出願日  
(日.月.年) 10.05.2005

優先日  
(日.月.年) 11.05.2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl.<sup>7</sup> G11B20/12, 20/10, 20/18

出願人（氏名又は名称）

松下電器産業株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- 第I欄 見解の基礎
- 第II欄 優先権
- 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第IV欄 発明の單一性の欠如
- 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- 第VI欄 ある種の引用文献
- 第VII欄 国際出願の不備
- 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

26.05.2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

齋藤 哲

5Q 4232

電話番号 03-3581-1101 内線 3591

## 第1欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

この見解書は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ  配列表

配列表に関連するテーブル

b. フォーマット  書面

コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期  出願時の国際出願に含まれる

この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3.  さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 1-11	有
	請求の範囲	無

進歩性 (IS)	請求の範囲	有
	請求の範囲 1-11	無

産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-11	有
	請求の範囲	無

## 2. 文献及び説明

## 請求項 1-5, 7-9, 11

文献1 : J P 05-210845 A (インターナショナル・ビジネス・マシンズ・コーポレーション) 1993. 08. 20 全頁, 全図  
& US 5303219 A

文献2 : J P 2000-322835 A (松下電器産業株式会社)  
2000. 11. 24 段落【0072】-【0075】，第1C図。  
& US 6160778 A

文献3 : J P 2000-021092 A (松下電器産業株式会社)  
2000. 01. 21 段落【0049】-【0085】(ファミリーなし)

文献1の特にオプション3には、ディスクの清掃後に再フォーマットを行う際に、前回欠陥となっていたセクタを再利用可能とマークして、当該セクタの書き込み動作に成功した場合に交替セクタを解放し、不成功であった場合には、交替セクタに記録して再利用ビットをオフにする技術が記載されている。

文献2には、SDLの構造が開示され、特に第1C図には、欠陥セクタと交替セクタの中間に予約領域を構成することが記載されている。

文献3には、欠陥セクタが再利用可能かどうかの検査結果を欠陥セクタと交替セクタのアドレスと共に管理しておくことが記載されている。

文献1では、再利用ビットにより再利用可能かどうかを判断しているものの、当該再利用ビットがどのように配置されるのか明確に開示されていない点が請求項1-5, 7-9, 及び11に係る発明と主に相違していますが、文献3に記載された欠陥セクタや交替セクタアドレスといった通常SDLが保持している情報と共に検査結果を保持しておくことが公知技術であること、及び、予約領域が事後に情報を追加する際に用いる領域であることを考慮すると、文献2に記載されているSDL構造の予約領域に、文献1の再利用ビットを配置することは当業者にとって容易です。

なお、請求項2及び3に関して、文献1では、上述した不成功であった場合の動作から判断すると、交替位置情報が維持されているものと認められ、この点は請求項2と相違していますが、再フォーマット時に消去するかどうかに技術的に有利な効果は見いだせず、当業者における設計的な事項と判断されます。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

請求項 6

文献1-3

文献4 : JP 2003-317206 A (株式会社日立製作所)  
2003. 11. 07 段落【0024】-【0025】，第5図  
(ファミリーなし)

文献4に記載されているように、欠陥部分の再生時にダミーデータを生成し、再生データに代えて用いることも公知の技術であり、文献1に当該公知技術を付加することは当業者にとって容易です。

請求項 6

文献1-3

文献5 : JP 2001-312865 A (株式会社日立製作所)  
2001. 11. 09 全頁，全図 (ファミリーなし)

文献5に記載されているように、ディスク装置において、欠陥検出をホストから見てブランクタイムに行なうことは周知技術にすぎず、文献1との組み合わせにも格別な点は認められません。